JP2002-259160A [0073]

[Effects of the Invention] According to this invention as described above, test items are extracted by using a functional pattern table that is created by representing the processing functions of a test target in a standardized pattern. Therefore, irrespective of knowledge and experiences of testers, all testers can extract the same test items. As a result, the test items can be extracted without fail and the quality of the test target can be improved. [0074]

In a case of remodeling or modifying a completed product, the processing functions before the remodeling and the processing functions after the remodeling can be easily compared by using the standardized functional pattern table. Therefore, specifications and information on past tests can be effectively used and the effective test items can be extracted with duplicate test work eliminated, resulting in reducing loads and time for test work.

and the second second

## BEST AVAILABLE COPY

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-259160

(43)Date of publication of application: 13.09.2002

(51)Int.CI.

G06F 11/28

G06F 17/60

(21)Application number: 2001-051678

(71)Applicant: NTT COMWARE CORP

(22)Date of filing:

27.02.2001

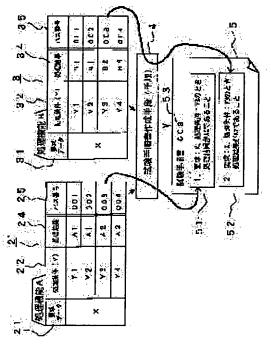
(72)Inventor: SASAKI HAJIME

WATANABE KATSUAKI

(54) DEVICE FOR TEST ITEM EXTRACTION SYSTEM, TEST ITEM EXTRACTION METHOD, RECORDING MEDIUM IN WHICH TEST ITEM EXTRACTION PROGRAM IS RECORDED AND TEST ITEM EXTRACTION PROGRAM

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device for a test item extraction system, a test item extraction method, a recording medium in which a test item extraction program is recorded and the test item extraction program to enable uniform extraction of a test item even when the extraction is performed by anyone without being influenced by knowledge and experience of a test operator. SOLUTION: Characteristic configuration technique to be constituted by passing a test procedure manual creating means 4 to create a test procedure manual 5 to indicate test procedures about a 'processing function A', a 'processing function B' by inputting function pattern tables 2', 3 to express the 'processing function A', the 'processing function B', etc., described in program specifications 1 of a testing object by standardized patterns is adopted.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

30.09.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-259160 (P2002-259160A)

(43)公開日 平成14年9月13日(2002.9.13)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

G06F 11/28

3 4 0

G06F 11/28

340A 5B042

17/60

106

17/60

106

審査請求 有 請求項の数14 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願2001-51678(P2001-51678)

(71)出願人 397065480

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社

東京都港区港南一丁目9番1号

(22)出願日 平成13年2月27日(2001.2.27)

(72)発明者 佐々木 一

東京都港区港南一丁目9番1号 エヌ・テ

イ・ティ・コムウェア株式会社内

(72)発明者 渡辺 活昭

東京都港区港南一丁目9番1号 エヌ・テ

ィ・ティ・コムウェア株式会社内

(74)代理人 100071113

弁理士 菅 隆彦

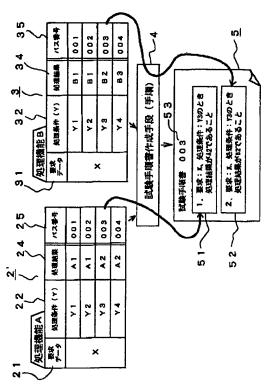
Fターム(参考) 58042 HH17 HH19 HH49

(54) 【発明の名称】 試験項目抽出システム装置、試験項目抽出方法、試験項目抽出プログラムを記録した記録媒体及び試験項目抽出プログラム

#### (57)【要約】

【課題】試験作業者の知識及び経験に左右されずに、誰が行なっても均一な試験項目の抽出を可能とする試験項目抽出システム装置、試験項目抽出方法、試験項目抽出プログラムを記録した記録媒体及び試験項目抽出プログラムの提供。

【解決手段】試験対象物のプログラム設計書1に記載された[処理機能A], [処理機能B]などを、標準化したパターンで現した機能パターン表2', 3が入力されることで、当該[処理機能A], [処理機能B]についての試験手順を示す試験手順書5を作成する試験手順書作成手段4を経てなる特徴的構成手法の採用。



【特許請求の範囲】

【請求項1】要求データと処理条件設定により処理結果 に導く試験項目抽出システム装置であって、

試験対象物の設計書に記載された処理機能を標準化した パターンで現した機能パターン表が入力されることで、 当該処理機能についての試験手順を示す試験手順書を作 成する試験手順書作成手段を有する、

ことを特徴とする試験項目抽出システム装置。

【請求項2】前記機能パターン表は、

それぞれ対応した前記処理結果とに分類して、表形式で 現されるとともに、表計算ソフトウェアを用いて前記設 計書に記載された複数の前記処理機能どとに、複数作成 されたものである、

ことを特徴とする請求項1に記載の試験項目抽出システ ム装置。

【請求項3】前記機能パターン表は、

複数の前記処理条件をそれぞれ特定する番号からなるパ ス番号が当該処理条件どとに付されており、

当該バス番号は、

複数の前記処理機能において同一の処理条件につき同一 の番号が付されており、

前記試験手順書作成手段は、

前記パス番号が入力されることで、当該パス番号に対応 した前記処理条件と当該処理条件に対応した処理結果と を、複数の前記機能パターン表から抽出して、各処理条 件どとに文章化した試験手順を示して前記試験手順書を 作成するものからなる、

ことを特徴とする請求項1又は2に記載の試験項目抽出 システム装置。

【請求項4】前記パス番号は、

前記処理機能についての反復処理の手順を示す枝番号を 有しており、

前記試験項目抽出システム装置は、

前記枝番号を有する前記パス番号が複数羅列されたもの からなるシナリオシートが入力されることで、当該シナ リオシートに羅列された当該パス番号の順序で、当該パ ス番号に対応した前記処理条件と当該処理条件に対応し た前記処理結果とを複数の前記機能パターン表から抽出 して、前記反復処理についての試験手順を文章化した前 40 記試験手順書を作成するシナリオ解析手段を、有してな る、

ことを特徴とする請求項3に記載の試験項目抽出システ ム装置。

【請求項5】前記試験項目抽出システム装置は、

所望の試験対象に係る前記処理条件を特定する前記パス 番号の入力を受けつけ、当該バス番号が前記枝番号を有 しているか否かを検出し、

当該枝番号を有している場合は、前記シナリオ解析手段 によって前記試験手順書を作成させ、

前記枝番号を有していない場合は、前記試験手順書作成 手段によって前記試験手順書を作成させるそれぞれの処 理方向の指示を与えるシナリオ検出手段を、有してな

ことを特徴とする請求項4に記載の試験項目抽出システ ム装置。

【請求項6】要求データと処理条件設定により処理結果 に導く試験項目抽出方法であって、

試験対象物の設計書に記載された処理機能につき、前記 前記処理機能を複数の前記処理条件と当該各処理条件に 10 処理条件と前記処理結果とに分けて、標準化したパター ンで現した機能パターン表を作成し、

> 当該機能パターン表を用いて当該試験対象物についての 所望の試験項目を抽出する、

ととを特徴とする試験項目抽出方法。

【請求項7】前記機能パターン表は、

前記処理機能の試験をするときに用いられる試験データ をなす前記要求データと、

前記処理機能の試験をするときに用いられる動作条件及 び環境条件をなす前記処理条件と、

前記処理機能が当該処理条件の下で前記要求データにつ 20 いて処理したときに、求められる正常な動作結果である 処理結果と、を表記してなる、

ことを特徴とする請求項6に記載の試験項目抽出方法。 【請求項8】前記機能パターン表は、

前記処理条件どとに付されている番号であって、当該処 理条件をそれぞれ特定する番号からなるバス番号を有し ており、

当該バス番号は、

複数の前記処理機能において同一の処理条件につき同一 30 の番号が付されており、

前記試験項目抽出方法は、

当該バス番号を特定することで、当該バス番号に対応し た前記処理条件と当該処理条件に対応した処理結果とを 複数の前記機能パターン表から抽出して、前記試験項目 とする、

ことを特徴とする請求項6又は7に記載の試験項目抽出 方法。

【請求項9】前記パス番号は、

前記処理機能についての反復処理の手順を示す枝番号を 有しており、

前記試験項目抽出方法は、

当該枝番号を有する前記パス番号を連続して順次特定す ることにより、当該パス番号の順序で、当該バス番号に 対応した前記処理条件と当該処理条件に対応した処理結 果とを複数の前記機能パターン表から抽出して、前記試 験項目とする、

ことを特徴とする請求項8に記載の試験項目抽出方法。 【請求項10】前記試験項目抽出方法は、

前記機能パターン表を作成し、その後、当該機能パター 50 ン表に基づいて、試験対象とする前記処理条件を前記パ

3

ス番号で特定したものからなるシナリオシートを作成するデータ入力処理と、

所望の試験対象に係る前記処理条件を特定する前記パス 番号の入力を受け、当該バス番号が前記枝番号を有して いるか否かを検出するシナリオ検出処理と、

#### を有し、

当該シナリオ検出処理で前記枝番号を有していると判断された場合は、当該枝番号が付された当該バス番号に対応する前記処理条件についての前記試験項目を抽出し、 当該シナリオ検出処理で前記枝番号を有していないと判 10 断された場合は、当該枝番号が付されていない当該バス番号に対応する前記処理条件についての前記試験項目を抽出する、

ことを特徴とする請求項9 に記載の試験項目抽出方法。 【請求項11】要求データと処理条件設定により処理結果に導く試験項目抽出プログラムをコンピュータ読取り 可能に記録した記録媒体であって、

試験対象物の設計書に記載された処理機能を標準化した パターンで現した機能パターン表が入力されることで、 当該処理機能についての試験手順を示す試験手順書を作 20 成する試験手順書作成手順を実行させるものであり、 前記機能パターン表は、

複数の前記処理条件をそれぞれ特定する番号からなるパス番号が当該処理条件ととに付されており、

当該バス番号は、

複数の前記処理機能において同一の処理条件につき同一 の番号が付されており、

前記試験手順書作成手順は、

前記パス番号が入力されることで、当該パス番号に対応 記試験手順書を作成するシナリオ解析手順と、 した前記処理条件と当該処理条件に対応した処理結果と 30 所望の試験対象に係る前記処理条件を特定する前記パス を、複数の前記機能パターン表から抽出して、各処理条 番号の入力を受けつけ、当該パス番号が前記枝番号を有 件ごとに文章化した試験手順を示して前記試験手順書を しているか否かを検出し、当該枝番号を有している場合 作成させる、 は、前記シナリオ解析手段によって前記試験手順書を作

ことを特徴とする試験項目抽出プログラムを記録した記録媒体。

【請求項12】前記パス番号は、

前記処理機能についての反復処理の手順を示す枝番号を有しており、

前記試験項目抽出プログラムを記録した記録媒体は、 前記枝番号を有する前記パス番号が複数羅列されたもの 40 からなるシナリオシートが入力されることで、当該シナ リオシートに羅列された当該パス番号の順序で、当該パ ス番号に対応した前記処理条件と当該処理条件に対応し た前記処理結果とを複数の前記機能パターン表から抽出 して、前記反復処理についての試験手順を文章化した前 記試験手順書を作成するシナリオ解析手順を、有してな ス

ことを特徴とする請求項11に記載の試験項目抽出プログラムを記録した記録媒体。

【請求項13】要求データと処理条件設定により処理結 50

果に導く試験項目抽出プログラムであって、

試験対象物の設計書に記載された処理機能を標準化した パターンで現した機能パターン表が入力されることで、 当該処理機能についての試験手順を示す試験手順書を作 成する試験手順書作成手順を実行させるものであり、 前記機能パターン表は、

複数の前記処理条件をそれぞれ特定する番号からなるパス番号が当該処理条件ととに付されており、

当該バス番号は、

複数の前記処理機能において同一の処理条件につき同一の番号が付されており、

前記試験手順書作成手順は、

前記パス番号が入力されることで、当該パス番号に対応 した前記処理条件と当該処理条件に対応した処理結果と を、複数の前記機能パターン表から抽出して、各処理条 件ごとに文章化した試験手順を示して前記試験手順書を 作成させる、

ことを特徴とする試験項目抽出プログラム。

【請求項14】前記パス番号は、

の 前記処理機能についての反復処理の手順を示す枝番号を 有しており、

前記試験項目抽出プログラムは、

前記枝番号を有する前記パス番号が複数羅列されたものからなるシナリオシートが入力されることで、当該シナリオシートに羅列された当該パス番号の順序で、当該パス番号に対応した前記処理条件と当該処理条件に対応した前記処理結果とを複数の前記機能パターン表から抽出して、前記反復処理についての試験手順を文章化した前記試験手順書を作成するシナリオ解析手順と、

所望の試験対象に係る前記処理条件を特定する前記パス番号の入力を受けつけ、当該パス番号が前記枝番号を有しているか否かを検出し、当該枝番号を有している場合は、前記シナリオ解析手段によって前記試験手順書を作成させ、前記枝番号を有していない場合は、前記試験手順書作成手段によって前記試験手順書を作成させるそれぞれの処理方向の指示を与えるシナリオ検出処理とを、有してなる、

ととを特徴とする請求項13に記載の試験項目抽出プログラム。

10 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ソフトウェア又は ハードウェアが設計書通りに作成されたか否かを試験す るときに用いられるものであって、試験作業の効率化及 び安定化、並びに製品の高品質化を可能とする試験項目 抽出方法及びその実施に直接使用するシステム装置、試 験項目抽出プログラムを記録した記録媒体及び試験項目 抽出プログラムに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ソフトウェア等を改造した場合

4

る。

は、その改造にかかわる機能を確認するための試験項目 と、改造にかかわらない従来の機能を確認するための試 験項目とを、設計書から人手で抽出している。との試験 項目の抽出は、デグレード防止の観点から行なわれてい る。そして、抽出した試験項目について試験を行ない、 一定以上の品質を維持している。

【0003】図5は、従来の試験項目抽出方法の手順を 示すフローチャートである。先ず、例えばプログラムの 改造が発生すると、作業者が設計書を読んで業務内容 (プログラムの機能)を解析する設計書解析を行なう (ST51)。次いで、設計書解析(ST51)に基づ いて、試験対象プログラムの機能を確認するための各種 の試験ケースを想定する試験ケース抽出を行なう(ST 52)。この試験ケースの抽出も作業者が人手で行な う。

【0004】引続き、試験ケース抽出(ST52)で想 定した試験ケースの中から実際に試験をする項目(試験 項目)を作業者が決定する確認内容決定を行なう(ST 53)。試験項目の対象となるのは、従来のプログラム に新規に追加した機能、改造した機能及び改造に関係す 20 る既存機能である。

【0005】その後、確認内容決定(ST53)で決定 された各試験項目につき、試験対象プログラムの処理条 件を作業者が設定する試験環境条件整理を行なう(ST 54)。更に、確認内容決定(ST53)及び試験環境 条件整理(ST54)に基づいて、実際に試験をすると きの手順を文書化したものである試験手順書を作業者が 作成する(ST55)。最後に、試験対象プログラムに つき、作業者が試験手順書に基づいて試験を実施する (ST56).

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 試験項目抽出方法では、設計書解析(ST51)から試 験手順書作成(ST55)まで作業者が手作業で行なっ ているので、各作業者の試験対象物(例えば、プログラ ム)についての知識レベルの相違によって、試験項目の 抽出の深さ及び範囲が異なってしまう。即ち、試験項目 の抽出方法が各作業者間において統一されておらず、各 作業者の熟練度及び経験によって試験品質及び試験効率 が左右されている。

【0007】これにより、従来の試験項目抽出方法で は、試験すべき機能につき試験項目として抽出しない項 目漏れが生じて、改造品又は製品の品質が低下してしま う。また、改造等がある毎に試験項目を抽出しなければ ならず、試験しなくてもよい機能につき試験項目とする 事態も生じるので、試験作業につき多大な労力及び時間 を要していた。特に、設計作業と試験作業とを分担して 行なう場合では、改造内容の引継ぎに多大な労力及び時 間を要していた。

目的は以下の通りである。即ち、本発明の第1の目的 は、ソフトウェア又はハードウェアを試験するときに用 いられるマニュアルであって、試験作業者の知識及び経 験に左右されずに、だれが行なっても均一な試験項目の 抽出を可能とする試験項目抽出システム装置、試験項目 抽出方法、試験項目抽出プログラムを記録した記録媒体

及び試験項目抽出プログラムを提供せんとするものであ

【0009】本発明の第2の目的は、ソフトウェア又は ハードウェアを試験するときに用いられるマニュアルで あって、試験項目の抽出漏れの防止及び試験対象物の品 質の向上を可能とする試験項目抽出システム装置、試験 項目抽出方法、試験項目抽出プログラムを記録した記録 媒体及び試験項目抽出プログラムを提供せんとするもの である。

【0010】本発明の第3の目的は、ソフトウェア又は ハードウェアを試験するときに用いられるマニュアルで あって、設計書及び過去の試験についての情報を効率的 に利用することを可能として、重複した試験作業を排除 し、効率的に試験項目を抽出することを可能として、試 験作業についての労力及び時間を低減することを可能と する試験項目抽出システム装置、試験項目抽出方法、試 験項目抽出プログラムを記録した記録媒体及び試験項目 抽出プログラムを提供せんとするものである。

【0011】本発明の他の目的は、明細書、図面、特 に、特許請求の範囲における各請求項の記載から自ずと 明らかとなろう。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明装置は、上記課題 30 の解決に当たり、試験対象物の処理機能を標準化したバ ターンで現した機能パターン表に基づいて、試験項目を 列挙して示す試験手順書を自動的に作成する試験手順書 作成手段を具備する構成手段を講じる特徴を有する。

【0013】本発明方法は、上記課題の解決に当たり、 試験対象物の処理機能につき、処理条件と処理結果とに 分けて標準化したパターンで現した機能パターン表を作 成し、当該機能パターン表を用いて試験項目を抽出して なる構成手法を講じる特徴を有する。

【0014】本発明記録媒体は、上記課題の解決に当た 40 り、試験対象物の処理機能を標準化したパターンで現し た機能パターン表に基づいて、試験項目を列挙して示す 試験手順書を自動的に作成する試験手順書作成手順を、 行う構成手順を講じる特徴を有するプログラムを記録す

【0015】本発明プログラムは、上記課題の解決に当 たり、試験対象物の処理機能を標準化したパターンで現 した機能パターン表に基づいて、試験項目を列挙して示 す試験手順書を自動的に作成する試験手順書作成手順 を、実行させる構成手順を講じる特徴を有する。

【0008】ここにおいて、本発明の解決すべき主要な(50~【0016】更に、具体的詳細に述べると、当該課題の

解決では、本発明が次に列挙する上位概念から下位概念 にわたる新規な特徴的構成手法又は手段を採用すること により、上記目的を達成するように為される。

【0017】即ち、本発明システム装置の第1の特徴 は、要求データと処理条件設定により処理結果に導く試 験項目抽出システム装置であって、試験対象物の設計書 に記載された処理機能を標準化したパターンで現した機 能パターン表が入力されることで、当該処理機能につい ての試験手順を示す試験手順書を作成する試験手順書作 成手段を有してなる試験項目抽出システム装置の構成採 10 用にある。

【0018】本発明装置の第2の特徴は、上記本発明シ ステムの第1の特徴における前記機能パターン表が、前 記処理機能を複数の前記処理条件と当該各処理条件にそ れぞれ対応した前記処理結果とに分類して、表形式で現 されるとともに、表計算ソフトウェアを用いて前記設計 書に記載された複数の前記処理機能ごとに、複数作成さ れたものである試験項目抽出システム装置の構成採用に ある。

【0019】本発明装置の第3の特徴は、上記本発明装 20 置の第1又は第2の特徴における前記機能パターン表 が、複数の前記処理条件をそれぞれ特定する番号からな るバス番号が当該処理条件でとに付されており、当該バ ス番号は、複数の前記処理機能において同一の処理条件 につき同一の番号が付されており、前記試験手順書作成 手段は、前記パス番号が入力されることで、当該パス番 号に対応した前記処理条件と当該処理条件に対応した処 理結果とを、複数の前記機能パターン表から抽出して、 各処理条件でとに文章化した試験手順を示して前記試験 手順書を作成するものからなる試験項目抽出システム装 30 置の構成採用にある。

【0020】本発明装置の第4の特徴は、上記本発明装 置の第3の特徴における前記パス番号が、前記処理機能 についての反復処理の手順を示す枝番号を有しており、 前記試験項目抽出システム装置は、前記枝番号を有する 前記パス番号が複数羅列されたものからなるシナリオシ ートが入力されることで、当該シナリオシートに羅列さ れた当該バス番号の順序で、当該バス番号に対応した前 記処理条件と当該処理条件に対応した前記処理結果とを 複数の前記機能パターン表から抽出して、前記反復処理 40 ン表から抽出して、前記試験項目としてなる試験項目抽 についての試験手順を文章化した前記試験手順書を作成 するシナリオ解析手段を、有してなる試験項目抽出シス テム装置の構成採用にある。

【0021】本発明装置の第5の特徴は、上記本発明装 置の第4の特徴における前記試験項目抽出システム装置 が、所望の試験対象に係る前記処理条件を特定する前記 パス番号の入力を受けつけ、当該パス番号が前記枝番号 を有しているか否かを検出し、当該枝番号を有している 場合は、前記シナリオ解析手段によって前記試験手順書 を作成させ、前記枝番号を有していない場合は、前記試 50 理と、を有し、当該シナリオ検出処理で前記枝番号を有

験手順書作成手段によって前記試験手順書を作成させる それぞれの処理方向の指示を与えるシナリオ検出手段 を、有してなる試験項目抽出システム装置の構成採用に ある。

【0022】本発明方法の第1の特徴は、要求データと 処理条件設定により処理結果に導く試験項目抽出方法で あって、試験対象物の設計書に記載された処理機能につ き、前記処理条件と前記処理結果とに分けて、標準化し たパターンで現した機能パターン表を作成し、当該機能 バターン表を用いて当該試験対象物についての所望の試 験項目を抽出してなる試験項目抽出方法の構成採用にあ る。

【0023】本発明方法の第2の特徴は、上記本発明方 法の第1の特徴において、前記機能パターン表が、前記 処理機能の試験をするときに用いられる試験データをな す前記要求データと、前記処理機能の試験をするときに 用いられる動作条件及び環境条件をなす処理条件と、前 記処理機能が当該処理条件の下で前記要求データについ て処理したときに、求められる正常な動作結果である処 理結果と、を表記してなる試験項目抽出方法の構成採用 にある。

【0024】本発明方法の第3の特徴は、上記本発明方 法の第1又は第2の特徴における前記機能パターン表 が、前記処理条件どとに付されている番号であって、当 該処理条件をそれぞれ特定する番号からなるパス番号を 有しており、当該パス番号は、複数の前記処理機能にお いて同一の処理条件につき同一の番号が付されており、 前記試験項目抽出方法は、当該パス番号を特定すること で、当該バス番号に対応した前記処理条件と当該処理条 件に対応した処理結果とを複数の前記機能パターン表か ら抽出して、前記試験項目としてなる試験項目抽出方法 の構成採用にある。

【0025】本発明方法の第4の特徴は、上記本発明方 法の第3の特徴における前記パス番号が、前記処理機能 についての反復処理の手順を示す枝番号を有しており、 前記試験項目抽出方法が、当該枝番号を有する前記パス 番号を連続して順次特定することにより、当該バス番号 の順序で、当該バス番号に対応した前記処理条件と当該 処理条件に対応した処理結果とを複数の前記機能パター 出方法の構成採用にある。

【0026】本発明方法の第5の特徴は、上記本発明方 法の第4の特徴における前記試験項目抽出方法が、前記 機能パターン表を作成し、その後、当該機能パターン表 に基づいて、試験対象とする前記処理条件を前記パス番 号で特定したものからなるシナリオシートを作成するデ ータ入力処理と、所望の試験対象に係る前記処理条件を 特定する前記バス番号の入力を受け、当該バス番号が前 記枝番号を有しているか否かを検出するシナリオ検出処

10

していると判断された場合は、当該枝番号が付された当該パス番号に対応する前記処理条件についての前記試験項目を抽出し、当該シナリオ検出処理で前記枝番号を有していないと判断された場合は、当該枝番号が付されていない当該パス番号に対応する前記処理条件についての前記試験項目を抽出してなる試験項目抽出方法の構成採用にある。

【0027】本発明記録媒体の第1の特徴は、要求デー タと処理条件設定により処理結果に導く試験項目抽出プ ログラムをコンピュータ読取り可能に記録した記録媒体 であって、試験対象物の設計書に記載された処理機能を 標準化したパターンで現した機能パターン表が入力され ることで、当該処理機能についての試験手順を示す試験 手順書を作成する試験手順書作成手順を実行させるもの であり、前記機能パターン表は、複数の前記処理条件を それぞれ特定する番号からなるパス番号が当該処理条件 どとに付されており、当該バス番号は、複数の前記処理 機能において同一の処理条件につき同一の番号が付され ており、前記試験手順書作成手順は、前記パス番号が入 力されることで、当該バス番号に対応した前記処理条件 と当該処理条件に対応した処理結果とを、複数の前記機 能パターン表から抽出して、各処理条件でとに文章化し た試験手順を示して前記試験手順書を作成させる試験項 目抽出プログラムを記録した記録媒体の構成採用にあ る。

【0028】本発明記録媒体の第2の特徴は、上記本発明記録媒体の第1の特徴における前記パス番号が、前記処理機能についての反復処理の手順を示す枝番号を有しており、前記試験項目抽出プログラムを記録した記録媒体は、前記枝番号を有する前記パス番号が複数羅列されるしたのからなるシナリオシートが入力されることで、当該シナリオシートに羅列された当該パス番号の順序で、当該パス番号に対応した前記処理条件と当該処理条件に対応した前記処理結果とを複数の前記機能パターン表から抽出して、前記反復処理についての試験手順を文章化した前記試験手順書を作成するシナリオ解析手順を、有してなる試験項目抽出プログラムを記録した記録媒体の構成採用にある。

【0029】本発明プログラムの第1の特徴は、要求データと処理条件設定により処理結果に導く試験項目抽出 40プログラムであって、試験対象物の設計書に記載された処理機能を標準化したパターンで現した機能パターン表が入力されることで、当該処理機能についての試験手順を示す試験手順書を作成する試験手順書作成手順を実行させるものであり、前記機能パターン表は、複数の前記処理条件をそれぞれ特定する番号からなるパス番号が当該処理条件でとに付されており、当該パス番号は、複数の前記処理機能において同一の処理条件につき同一の番号が付されており、前記試験手順書作成手順は、前記パス番号が入力されることで、当該パス番号に対応した前 50

記処理条件と当該処理条件に対応した処理結果とを、複数の前記機能パターン表から抽出して、各処理条件ごとに文章化した試験手順を示して前記試験手順書を作成させる試験項目抽出プログラムの構成採用にある。

【0030】本発明プログラムの第2の特徴は、上記本 発明プログラムの第1の特徴における前記パス番号が、 前記処理機能についての反復処理の手順を示す枝番号を 有しており、前記試験項目抽出プログラムは、前記枝番 号を有する前記パス番号が複数羅列されたものからなる 10 シナリオシートが入力されることで、当該シナリオシー トに羅列された当該バス番号の順序で、当該バス番号に 対応した前記処理条件と当該処理条件に対応した前記処 理結果とを複数の前記機能パターン表から抽出して、前 記反復処理についての試験手順を文章化した前記試験手 順書を作成するシナリオ解析手順と、所望の試験対象に 係る前記処理条件を特定する前記パス番号の入力を受け つけ、当該バス番号が前記枝番号を有しているか否かを 検出し、当該枝番号を有している場合は、前記シナリオ 解析手段によって前記試験手順書を作成させ、前記枝番 号を有していない場合は、前記試験手順書作成手段によ って前記試験手順書を作成させるそれぞれの処理方向の 指示を与えるシナリオ検出処理とを、有してなる試験項 目抽出プログラムの構成採用にある。

[0031]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しながら、 本発明の実施の形態をシステム装置例及び方法例につき 説明する。

【0032】なお、本発明は、試験対象物の設計書に基づいて、実際に試験をするときに用いられる試験データ(要求データ)、当該試験における試験対象物の環境条件である処理条件及びその処理結果を設定して、標準化した表(機能パターン表)として現し、との機能パターン表を用いて試験項目を抽出するものであるが、本実施形態例ではプログラムを試験対象物の一例に挙げて説明するも、これ等に限定されるものではない。

【0033】(システム装置例)図1は、本実施形態のシステム装置に用いられる機能パターン表の概念的模式図である。図中、1は試験対象となるプログラム(以下、「試験対象プログラム」という)の機能概要を表したプログラム設計書、2は試験対象プログラムにおける一つの機能処理機能Aに要求される機能(処理条件と処理結果)を標準化したパターンで現した機能パターン表である。

【0034】プログラム設計書1には、試験対象プログラムを実際に試験をするときに用いられる試験データである「要求データ(X)]11と、当該試験における試験対象プログラムの動作条件又は環境条件である「処理条件(Y)]12と、試験対象プログラムが持っている複数の機能の内の1つをなす「処理機能A]13と、「処理機能A]13が「処理条件(Y)]12の下で

(7)

[要求データ(X)] 11について処理したときに求められる正常な動作結果即ち正常な試験結果である[処理結果A1又は処理結果A2]14と、が記載されている

11

【0035】なお、試験対象プログラムは、通常、[処理機能A]13以外に多数の処理機能を有しているが、本例では[処理機能A]13を代表例として挙げて説明している。

【0036】機能パターン表2は、プログラム設計書1 に記載されている試験対象プログラムの[処理機能A] 13についての、[要求データ(X)]11、[処理条件(Y)]12及び[処理結果A1又は処理結果A2] 14を、予め定めた様式の表(標準化したパターン)に現したものである。

【0037】また、機能パターン表2は、試験対象プログラムにおける処理機能Aを作成したプログラマが、プログラム設計書1の作成に伴って作成したものであり、表計算ソフト等を用いて手作業で作成したものである。なお、プログラム設計書1を解析するプログラムを作成して、そのプログラムによって自動的に機能パターン表 202を作成することとしてもよい。機能パターン表2は、「処理機能A】13についてのものだけでなく、試験対象プログラムをなす全ての処理機能A,処理機能B,処理機能C,…についてそれぞれ作成される。

【0038】機能パターン表2における[要求データ(X)]21はプログラム設計書1の[要求データ

(X)] 11に対応し、[処理条件(Y)] 22は[処理条件(Y)] 12に対応し、[処理結果] 24は[処理結果A1又は処理結果A2] 14に対応する。

【0039】とれらにより、機能パターン表2によれば、試験対象プログラムに要求される機能(入力データ、条件及び結果)を、[要求データ(X)]21、[処理条件(Y)]22及び[処理結果]24として、標準化したパターンで表すので、試験対象プログラムの機能全体を俯瞰できるようになり、試験作業者の知識及び経験に左右されずに均一な試験項目の抽出が可能となる。

【0040】図2は、本実施形態のシステム装置の要素をなす試験手順書作成手段の概念的模式図である。ことで、試験手順書作成手段は、図1に示すような機能パターン表を用いて試験手順書を作成するものである。

【0041】図中、2、は試験対象プログラムにおける 処理機能Aに要求される機能を標準化した機能パターン 表、3は試験対象プログラムにおける処理機能Bに要求 される機能を標準化した機能パターン表、4は本実施形 態のシステム装置の一部をなす試験手順書作成手段、5 は試験手順書作成手段4によって作成された文書の一例 である試験手順書である。

【0042】機能パターン表2'は、図1に示す機能パ 25,35(枝番付き)を用いて表現したシナリオシーターン表2に対してパス番号25を埋め込んだものであ 50 ト、8は図2に示すような機能パターン表2',3及び

る。パス番号25は、各[処理条件(Y)]22のそれぞれにつきユニークな番号を付したものである。機能パターン表3にも機能パターン表2、と同様に、各[処理条件(Y)]32のそれぞれにパス番号35が付されている。

【0043】 CCで、機能パターン表2、と機能パターン表3とを比べると、「要求データ(X)] 21と「要求データ(X)] 31がともに「X」であって同一であり、「処理条件(Y)] 22と「処理条件(Y)] 32 もそれぞれ「Y1、Y2、Y3、Y4」であって同一であるが、「処理結果] 24と「処理結果] 34とは異なっている。これは、機能パターン表2、は処理機能Aについての表であり、機能パターン表3は処理機能Bについての表であって、処理機能が異なるので、入力データが同じでも出力が異なることによる。

【0044】パス番号25とパス番号35を比べると、各[処理条件(Y)]32のそれぞれに同一の番号が付されている。これは、各処理機能A、B…における同一の処理条件(Y)につきそれぞれ同一のパス番号25、35を付すことで、プログラムの一部改造等により発生したマトリクスに該当する試験項目を一意に決定して、かかる試験項目を漏れなく抽出するためである。

【0045】試験手順書作成手段4は、試験対象プログラムにおける所望の事象(所望の処理条件など)を試験するときに、その試験をするための処理項目を自動的に抽出して、試験手順書5を自動的に作成するものである。

【0046】試験手順書作成手段4には、予め機能バターン表21、機能パターン表3…等が入力される。例え 30 ば、試験対象プログラムにおける[処理条件(Y)]2 2の「Y3」の部分について改造されたので、この改造部分について試験したい場合は、作業者が試験手順書作成手段4に対してバス番号「003」を入力する。すると、試験手順書作成手段4は、図2に示すような試験手順書5を自動的に作成する。

【0047】試験手順書5には、一例として、処理機能 Aについての試験項目51と、処理機能Bについての試 験項目52と、パス番号に対応する試験手順書番号53 が記載されている。

【0048】 これらにより、作業者は、試験手順書5の 記載通りに試験作業を実施すれば、プログラムの一部改 造等により発生した試験対象部位(改造部位に関係する 機能)について、漏れなく試験することができる。

【0049】図3は、本実施形態のシステム装置の要素をなすシナリオ解析手段の概念的模式図である。図中、6は試験対象プログラムにおける試験対象とする部分が実行する反復処理等を示すフローチャート、7はフローチャート6についての処理手順を図2におけるバス番号25,35(枝番付き)を用いて表現したシナリオシー

シナリオシート7に基づいて試験手順書を作成するシナ リオ解析手段、5′はシナリオ解析手段8よって作成さ れた文書の一例である試験手順書である。

13

【0050】フローチャート6では、ST1で処理機能 Aにおけるパス番号「003」(枝番号1)が実行さ れ、その後、ST2で処理機能Bにおけるパス番号「0 03」(枝番号2)が実行され、その後、再びST1で 処理機能Aにおけるパス番号「003」(枝番号1)が 実行されるものとする。

すと、「003-1」、「003-2」、「003-1」となり、シナリオシート7が出来あがる。シナリオ シート7の作成は、作業者が機能パターン表2',3を 参照して手作業で作成する。そして、作業者は、シナリ オシート7の内容をシナリオ解析手段8に入力する。な お、機能パターン表2', 3をシナリオ解析手段8に入 力されることによって、当該シナリオ解析手段8が自動 的にシナリオシート7を作成することとしてもよい。

【0052】シナリオ解析手段8は、シナリオシート7 及び機能パターン表2', 3に基づいて、試験手順書 5'を自動的に作成する。試験手順書5'において、試 験項目51はバス番号「003-1」についての試験内 容であり、試験項目52はパス番号「003-2」につ いての試験内容であり、試験項目51′はパス番号「0 03-1」についての試験内容である。

【0053】これらにより、パス番号に枝番号を付すと とによって当該パス番号を階層構造にすることで、試験 対象部位が反復処理等をする手順であっても、当該手順 をシナリオシート7として表現することが可能となっ て、当該反復処理等について各種の実行パターンを漏れ なく試験することが可能となり、反復処理等について精 度の高い試験をすることが可能となる。

【0054】(方法例)前記システム装置例に適用する 本実施形態の方法例につき図4を参照して説明する。図 4は、本実施形態例の試験項目抽出システム装置の実行 手順を示すフローチャートである。

【0055】図中、10は作業者、60は作業者10に よって入力される各種のデータ入力処理、70はデータ 入力処理60が作業者10によって行なわれると試験項 目を自動的に抽出する試験項目抽出システムである。

【0056】先ず、作業者10は、パーソナル・コンビ ュータ等を操作して表計算ソフト等を用いることによっ て、機能パターン表62、63、64を作成する。こと で、機能パターン表62は、試験対象プログラムの一部 であってコンピュータ内部での処理(内部処理)を実行 するプログラムの機能を示す表である。機能パターン表 63は、試験対象プログラムの一部であって画面表示に 関する処理(画面処理)を実行するプログラムの機能を 示す表である。機能パターン表64は、帳票に関する処

ある。

(8)

【0057】また、機能パターン表62は内部処理を実 行するプログラムを作成した作業者が作成し、機能バタ ーン表63は画面処理を実行するプログラムを作成した 他の作業者が作成し、機能バターン表62は帳票処理を 実行するプログラムを作成した他の作業者が作成する。 【0058】通常、1つのプログラムは多数の作業者に よって作成されるが、各作業者が自分の担当部分のプロ グラムについて機能パターン表をそれぞれ作ることで、 【0051】この手順をバス番号(枝番号付き)で現わ 10 プログラムの各種機能を標準化したバターンで表すこと ができ、プログラムの作成者以外の者でもプログラム全 体を容易に俯瞰することが可能となる。

> 【0059】その後、作業者は、機能パターン表62, 63,64を参照して、シナリオシート61を作成す る。このシナリオシート61は、図3におけるシナリオ シート7と同様のものである。このシナリオシート61 の作成も作業者10がパーソナル・コンピュータ等を操 作して表計算ソフト等を用いることによって行なう。 【0060】機能パターン表62,63,64におい

20 て、関連性が比較的高い処理条件(例えば、)について は、それぞれ同じ番号のパス番号(枝番号は異なる)が 付されている。そこで機能パターン表62,63,64 からパス番号が「001-\*」の項目をピックアップす ると、「001-1」、「001-2」、「001-3」、「001-4」となり、シナリオシート61が出 来あがる。

【0061】そして、作業者10は、機能パターン表6 2.63.64及びシナリオシート61を試験項目抽出 システム70に入力する。この入力は、機能パターン表 30 62, 63, 64及びシナリオシート61の作成に用い た表計算ソフト等を介して実行してもよい。

【0062】次に、作業者10は、試験対象プログラム における試験対象とする部分に該当するパス番号を試験 項目抽出システム70に入力する(ST11)。すると、 試験項目抽出システム70は、ST11で入力されたパ ス番号に該当するシナリオシート61が作成されている か否か検索するシナリオ検出処理を行なう(ST12)。 ととで、ST11で入力されたパス番号に枝番号がある 場合は、「シナリオ有り」と判断する(ST13)。

【0063】ST13で、「シナリオ無し」と判断され た場合、例えば、ST11で入力されたパス番号が枝番 号のない「002」の場合は、試験手順書編集処理(S T14)が実行される。試験手順書編集処理(ST14) は、図2に示す試験手順書作成手段4が行なう処理であ る。即ち、試験手順書編集処理(ST14)では、ST1 1で入力されたパス番号(例えば、「002」)につ き、全ての機能パターン表62,63,64を検索し て、試験項目の抽出及び編集をする。

【0064】例えば、内部処理についての機能パターン 理(帳票処理)を実行するプログラムの機能を示す表で 50 表62におけるバス番号「002」に該当する試験項目 は [処理条件: Y1] [処理結果: A1] であり、画面 処理についての機能バターン表63におけるバス番号 「002」に該当する試験項目は[処理条件:Y1] [処理結果:A2]であり、帳票処理についての機能パ ターン表64におけるパス番号「002」に該当する試 験項目は「処理条件:Y1] 「処理結果:A3]であ り、これらが抽出及び編集される。

【0065】ST13で、「シナリオ有り」と判断され □ た場合、例えば、ST11で入力されたパス番号が枝番 号のある「001」の場合は、試験手順書編集処理(S T15)が実行される。試験手順書編集処理(ST15) は、図3に示すシナリオ解析手段8が行なう処理であ る。即ち、試験手順書編集処理(ST15)では、ST1 1で入力されたパス番号(例えば、「001」)につ き、全ての機能パターン表62,63,64を検索し て、枝番号順に試験項目の抽出及び編集をする。

【0066】例えば、内部処理についての機能パターン 表62におけるパス番号「001-1」に該当する試験 項目は [処理条件: Y 1] [処理結果: A 1] であり、 画面処理についての機能パターン表63におけるパス番 20 る。 号「001-2」に該当する試験項目は[処理条件:Y 1] [処理結果: A2] である。

【0067】内部処理についての機能パターン表62に おけるパス番号「001-3」に該当する試験項目は [処理条件:Y2] [処理結果:A4]であり、画面処 理についての機能パターン表63におけるパス番号「0 01-4」に該当する試験項目は [処理条件:Y2] [処理結果:A5]であり、これらが順次に抽出及び編 集される。

【0068】また、試験手順書編集処理(ST14)及び 30 試験手順書編集処理(ST15)では、それぞれ、試験項 目の抽出及び編集をしてそれぞれ試験手順書を作成す る。この試験手順書は、図2の試験手順書5又は図3の 試験手順書5' に相当するものである。

【0069】作業者10は、この試験手順書に基づいて 試験対象プログラムに対して試験をすることで、試験対 象プログラムにおける所望の試験対象部分につき、テス ト漏れのない高品質な試験を簡易かつ迅速に実施すると とが可能となる。

【0070】(記録媒体例、プログラム例)前記装置例 40 を制御し、前記方法例を実施する本実施形態の記録媒体 例及びプログラム例を次に説明する。本プログラム例 は、上述し図4に示すST11~ST15の処理手順 を、パーソナル・コンピュータ等のコンピュータにおい て実行させるものとする。即ち、パス番号の入力(ST 11)、シナリオ検出処理(ST12)、シナリオ有無 の判断(ST13)及び試験手順書編集処理(ST1 4, ST15)を、パーソナル・コンピュータ等に実行 させるプログラムとする。

【0071】本記録媒体例は、上述のプログラム例がパ 50 12,22,32…処理条件(Y)

ーソナル・コンピュータ等に読取り可能に記録された記 録媒体とする。本記録媒体は、プロッピーディスク、コ ンパクトディスクのみならず、パーソナル・コンピュー タ等に内蔵されるハードディスク或いは半導体記録媒体 でもよい。

【0072】以上、本発明の代表的なシステム装置例、 方法例、記録媒体例及びプログラム例について説明した が、本発明は、必ずしも上記した事項に限定されるもの ではない。本発明の目的を達し、下記する効果を奏する 10 範囲において、適宜変更実施可能である。例えば、試験 対象物としては、プログラムに限定されるものではな く、ハードウェアを試験対象物としてもよい。 [0073]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 試験対象物の処理機能につき標準化したバターンで現し た機能パターン表を用いて試験項目を抽出するので、試 験作業者の知識及び経験に左右されずに、だれが行なっ ても均一な試験項目の抽出が可能となり、試験項目の抽 出漏れの防止及び試験対象物の品質の向上が可能とな

【0074】また、完成品についての改造又は改良をし た場合においては、標準化された機能パターン表を用い ることで、改造等の前の処理機能と改造等に関する処理 機能とを容易に比較対象することが可能となるので、設 計書及び過去の試験についての情報を効率的に利用する ことが可能となり、重複した試験作業を排除し、効率的 に試験項目を抽出することが可能となり、試験作業につ いての労力及び時間を低減することが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のシステム装置例に用いられる機能バタ ーン表の概念的模式図である。

【図2】本発明のシステム装置例の要素をなす試験手順 書手段の概念的模式図である。

【図3】本実施形態のシステム装置の要素をなすシナリ 才解析手段の概念的模式図である。

【図4】本発明の方法例の実行手順を示すフローチャー トである。

【図5】従来の試験項目抽出方法の手順を示すフローチ ャートである。

#### 【符号の説明】

1…プログラム設計書

2, 2', 3, 62, 63, 64…機能パターン表

4…試験手順書作成手段

5, 5'…試験手順書

6…フローチャート

7.61…シナリオシート

8…シナリオ解析手段

10…作業者

11, 21, 31…要求データ(X)

13…処理機能A

14 ···処理結果A1及び処理結果A2

24,34…処理結果

25,35…パス番号

Y I

Y 2

Y 3

Y 4

X

ΑI

A 1

A 2

A 2

5 1

52-

001

002

003

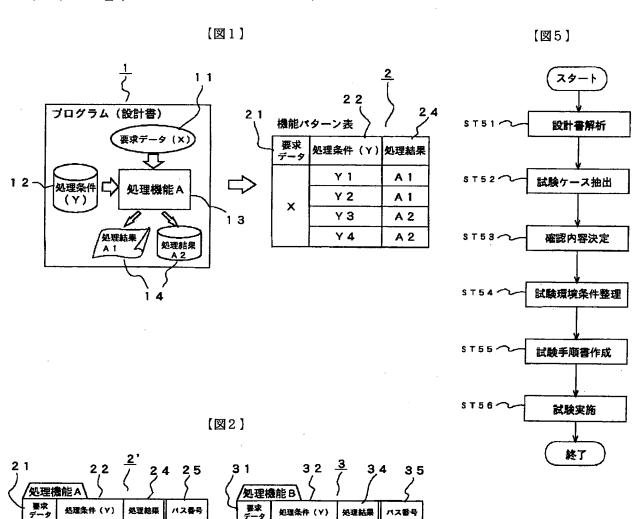
004

\*51,52,51'…試験項目

60…データ入力処理

70…試験項目抽出システム

\*



Y 1

Y 2

Y3

Y 4

試験手順書作成手段 (手順)

1. 要求: X、処理条件: Y3のとき 処理結果がA2であること

2、要求:X、処理条件:Y3のとき 処理結果が82であること

X

試験手順書 003

B 1

B 1

B 2

в 3

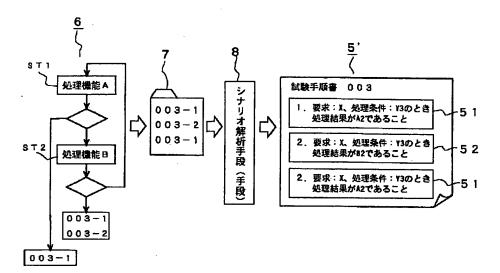
001

002

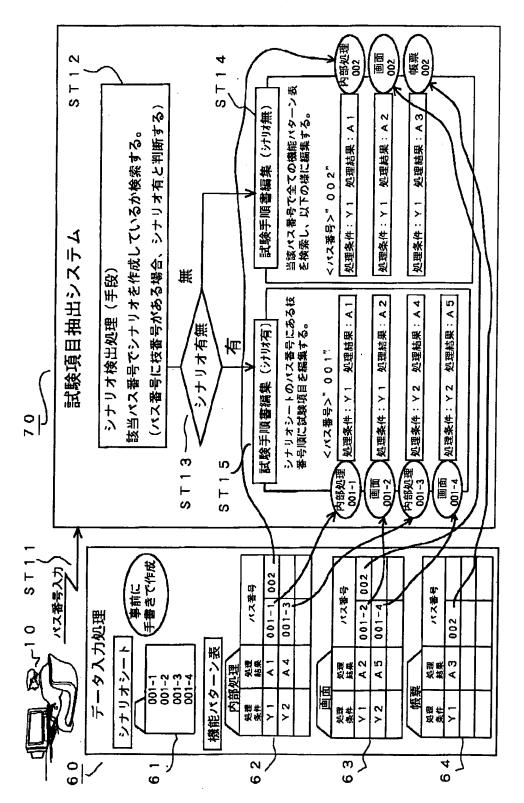
003

004

[図3]



【図4】



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: \_\_\_\_\_

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.